

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学マテリアル先端リサーチインフラ
実施要領

令和4年3月31日
学 長 裁 定

(趣旨)

第1条 この要領は、文部科学省科学技術試験研究委託事業「マテリアル先端リサーチインフラ」に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学（以下「本学」という。）が保有する先端的な研究技術及び共用設備（以下「共用設備等」という。）を産官学の多様な利用者（以下「利用者」という。）に提供する事業（以下「本事業」という。）に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本事業は、我が国におけるデータ駆動型の研究開発を更に加速すべく、マテリアル研究開発に関する研究データを効率的かつ継続的に創出するとともに、当該データを戦略的に収集・蓄積し利活用するための全国的な共用基盤であるマテリアル先端リサーチインフラの構築に向け、ナノテクノロジープラットフォームを通じて整備してきた本学が保有するマルチマテリアル化技術及び次世代高分子マテリアル領域に関する先端的な共用設備等を利用者に対して柔軟に提供することを目的とする。

(定義)

第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 利用 有償又は無償により、善良な自己の注意をもって共用設備等を使用し、実験に関するデータ等の取得、実験用試料等の処理等を行うことをいう。

(2) 秘密情報 本事業の過程において、利用者若しくは本学が相手方から提供若しくは開示を受け、又は自己において知り得た、技術上、営業上その他の一切の情報のうち、「秘」等秘密である旨の表示を付した図面、技術資料等文書又は電子媒体により開示されたもの、口頭で開示される情報であって、開示の際に秘密である旨明示され、開示後15日以内に開示内容が記載され、かつ、「秘」等秘密の旨の表示を付した文書で提供されたもの及び試料、サンプルその他物で開示される情報であって、開示の際に秘密である旨明示され、開示後15日以内に当該物を特定できる内容が記載され、かつ、「秘」等秘密の旨の表示を付した文書が提供された当該物に係るものの総称をいう。ただし、次に掲げる区分のいずれかに該当する情報については、この限りではない。

イ 相手方から開示を受け、又は知得した時点で、既に自己が保有していた

- ことを証明できるもの
- ロ 相手方から開示を受け、又は知得した時点で、既に公知となっているもの
 - ハ 相手方から開示を受け、又は知得した後、自己の責めによらずに公知となったもの
 - ニ 正当な権限を有する第三者から適法に知得したことを証明できるもの
 - ホ 相手方から開示を受けた情報によることなく独自に創出し、又は知得していたことを証明できるもの
 - ヘ 相手方から開示を受けた後、秘密情報によらずに独自に創出したもの
 - ト 書面により事前に相手方の同意を得たもの
 - チ 法令により開示が義務付けられたもの又は関係する府省若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求められたもの
- (3) 知的財産権 次の各号に掲げるものをいう。
- イ 特許権等 特許法（昭和34年法律第121号）に規定する特許権、実用新案法（昭和34年法律第123号）に規定する実用新案権、意匠法（昭和34年法律第125号）に規定する意匠権、特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利及び外国におけるこれらの権利に相当する権利
 - ロ 著作権 著作権法（昭和45年法律第48号）に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物に係る著作権並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
 - ハ 回路配置利用権 半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和60年法律第43号）に規定する回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び外国におけるこれらの権利に相当する権利
 - ニ 育成者権 種苗法（平成10年法律第83号）に規定する育成者権、品種登録を受ける地位及び外国におけるこれらの権利に相当する権利
 - ホ 技術ノウハウを使用する権利 イからニに掲げる権利の対象とならない技術情報（実験データ、サンプル等の試料及び図面等を含む。）であって、秘匿することが可能なものかつ財産的価値のあるもののうちから、本学と利用者が合意の上で特に指定するものを使用する権利

(支援内容)

第4条 本事業は、次に掲げる支援業務を行う。

- (1) 技術相談 利用者が共用設備等を利用するに当たり、本学の研究者又は技術者（以下「研究者等」という。）が、技術的な相談等に応じるもの
- (2) 技術代行 利用者の依頼に基づき、本学の研究者等が、共用設備等を利用し代行して、加工、分析又は操作等を行うもの
- (3) 技術補助 本学の研究者等が技術的な補助を行いつつ、利用者が共用設備等を利用して加工、分析又は操作等を行うもの

- (4) 機器利用 利用者が、共用設備等を利用して加工、分析又は操作等を行うもの（本学の研究者等が必要に応じて技術的な指導等を行うことを含む。）
- (5) 共同研究 利用者が行う研究に対し、本学の研究者等が共用設備等を利用し利用者と共同して、加工、分析又は操作等を行うもの

(責任者)

第5条 本事業を実施するため、責任者を置き、マテリアル研究プラットフォームセンター長（以下「センター長」という。）をもって充てる。

(利用条件)

第6条 共用設備等の提供に当たっては、本学の研究及び教育に支障がなく、かつ、マテリアル先端リサーチインフラの趣旨に鑑み、利用者の要請に応え、又は健全な事業活動に資すると認められる場合に限り行うものとする。

2 利用者は、次の各号に掲げることについて同意するものとする。

- (1) 本事業の利用内容を公表すること。
- (2) 前号の利用内容をはじめとする本事業の利用を通じて創出される研究データ及びこれに関連して利用者及び本学が保有する情報を本学に収集・蓄積し、マテリアル先端リサーチインフラにおけるセンターハブ、ハブ及びスポークの各機関に提供すること。ただし、センター長が特別の事情があると認める場合は、利用者との協議により、当該研究データ及び情報の一部又は全部の収集・蓄積又は提供を行わないことができる。

(利用申請)

第7条 利用者は、本事業を利用するに当たり、あらかじめ、センター長に申請しなければならない。

(委員会)

第8条 センター長は、前条の利用申請の審査を行うため、マテリアル先端リサーチインフラ審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。

2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

- (1) センター長
- (2) センター長が指名する教員 若干名
- (3) その他センター長が必要と認める者

3 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を主宰する。

(利用審査)

第9条 センター長は、前条の審査の結果に基づき、本事業の利用の可否を決定し、当該決定を利用者に通知するものとする。

(料金)

第10条 本事業の料金(第6条第2項第2号ただし書の場合を含む。以下「利用料」という。)は、別表のとおりとする。

- 2 前項の場合において、特に必要が認められるときは、センター長は委員会の承認を経て、利用料の一部又は全額を免除することができる。
- 3 利用料は、前納とする。
- 4 前項の規定にかかわらず、センター長が認めた場合は、支援業務終了後に利用料を納付することができる。この場合において、納付期限は、本学が発行する請求書の発行日の属する月の翌月末日とする。
- 5 本学は、原則として納付された利用料は利用者に返還しない。

(利用内容の報告)

第11条 利用者は、本事業の利用内容を支援業務が終了した年度の年度末までに、センター長に報告しなければならない。

(利用内容の公表)

第12条 センター長は、前条の利用内容をマテリアル先端リサーチインフラにおけるセンターハブ機関を通じて速やかに公表するものとする。この場合において、本学は、当該利用内容が公表されるまでの間、当該利用内容に関する一切の情報(利用者が公表並びに収集・蓄積及び提供等について承諾したもの、既に公表されているもの並びに秘密を保持することを約した契約等の締結の下に特定の者に開示することが認められたものを除く。)について第三者に開示し、提供し、又は漏えいしてはならない。

- 2 利用者は、特許出願を目的として当該利用内容の公表について延期を希望する場合、センター長の承認を受けることにより、支援業務が終了した当該年度末から最大2年間、公表を延長することができる。

(遵守事項)

第13条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

- (1) この要領その他の学内規則及び法令に違反する行為を行わないこと。
- (2) 本学の研究者等の指示及び共用設備等の利用方法(共用設備等を破損する又はそのおそれがある行為を行わないことを含む。)に違反する行為を行わないこと。
- (3) 事故等危険が惹起される行為を行わないこと。
- (4) その他本学の研究及び教育に支障となる行為を行わないこと。

(中止等)

第14条 開始された支援業務は、本学又は利用者の利益を一方的に害する場合は、原則として中止することはできない。ただし、当該支援業務において前条各号に定める遵守事項のいずれかを満たさない事態が生じた場合、本学は

当該支援業務を中止することができる。

- 2 本学及び利用者は、天災その他本事業の遂行上やむを得ない事由がある場合、相手方と協議の上、支援業務を中止し、又は利用期間を延長することができる。この場合において、本学は、当該支援業務に関して利用者に生じた損害については、その責を負わない。
- 3 本学は、前項の規定により支援業務を中止した場合であって、本学が特に必要と認めたときは、第10条の規定にかかわらず、利用者と協議の上、不用となった額の範囲内で利用者に対し、利用料の一部又は全部を返還することができる。

(情報の取扱い)

第15条 利用者は、本事業の利用を通じて創出される研究データ及びこれに関連する情報を適切に管理するものとする。

- 2 利用者及び本学は、センター長が別に定めるデータ登録に関する約款に基づき、本事業の利用を通じて創出される研究データ及びこれに関連して利用者及び本学が保有する情報を本学に収集・蓄積し、マテリアル先端リサーチインフラにおけるセンターハブ、ハブ及びスポークの各機関に提供するものとする。
- 3 利用者及び本学は、秘密情報について、本事業の目的以外の目的のために複製し、又は利用してはならない。
- 4 利用者及び本学は、秘密情報について、第三者に開示し、又は提供してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りでなく、この場合において、利用者又は本学は、この要領において自己が負う秘密保持義務と同様の秘密保持を当該第三者に義務付けるよう措置を講ずるものとする。
- 5 前項において、開示又は提供を受けた第三者（次項において「受領者」という。）は、秘密情報について、当該開示又は提供を受けた目的以外の目的のために複製し、又は利用してはならない。
- 6 受領者は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられている場合又は関係する府省若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求められた場合は、必要かつ妥当な範囲でこれを開示することができる。ただし、開示するときは、あらかじめ相手方に当該内容を書面にて通知するものとする。
- 7 利用者及び本学は、本事業の実施に関与する者に対し、この要領において自己が負う秘密保持義務と同様の秘密保持を義務付けるよう措置を講ずるものとする。
- 8 利用者及び本学は、秘密情報について、相手方に対し自己が開示した当該情報に瑕疵があった場合でも、瑕疵担保責任を含む一切の責を負わないものとし、それらについて一切の明示又は黙示の保証をしないものとする。
- 9 利用者は、第13条各号に定める遵守事項のいずれかを満たさない事態が生じた場合をはじめ、本学が特に必要と認める場合は、本学の求めに応じ、必

要な全ての情報を本学に提供するものとする。

(知的財産権の帰属)

第16条 本事業の利用による発明等に係る知的財産権の帰属に関する取扱いは、本学及び利用者が協議して決定する。ただし、秘密情報を用いることなく新たに得られた当該知的財産権については、利用者に帰属するものとする。

(事故補償の免責等)

第17条 利用者が、本事業の利用に当たって事故、災害等に遭遇した場合は、当該利用者が所属する学術研究機関又は企業が、従業員に適用する補償制度をもって補償することを原則とする。ただし、当該事故、災害等が、本学の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。

2 利用者が本事業の利用に当たって提出した実験用試料等に滅失又は毀損が生じた場合は、本学の責めに帰すべき事由によるものを除き、本学はその責を負わないものとする。

3 利用者は、本事業の利用によって第三者との間で紛争が生じた場合は、自己の責任と負担により解決するものとし、本学はその責を負わないものとする。

(損害賠償)

第18条 利用者は、本事業の利用に当たり、当該利用者の責に帰すべき事由によって、共用設備を滅失し、又は損傷した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(存続条項)

第19条 第15条から第18条の規定は、利用者が本事業の利用を終了した後も、各条項の遵守に必要な限りにおいて引き続き効力を有するものとする。

(事務)

第20条 本事業の実施に関する事務は、事業推進部研究協力課が行う。

(雑則)

第21条 この要領に定めのない事項については、本学が定める規則等の定めるところによるほか、センター長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(ナノテクノロジープラットフォーム取扱要領の廃止)

2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学ナノテクノロジープラットフォーム

ーム取扱要領（平成25年4月1日学長裁定）は、廃止する。

（経過措置）

- 3 前項の規定にかかわらず、この要領の施行前に国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学ナノテクノロジープラットフォーム取扱要領第4条の規定により利用者が共用設備等の利用申請を行ったものに係る事業の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則

この要領は、令和4年10月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和5年1月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和6年7月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

各支援業務及び共用設備等における利用料一覧

業務	共用設備等 (通称、型番等)	利用料（円）（消費税及び地方消費税を除く。）			試験単位等 (標準測定時間)
		（）内は、第6条第2項第2号ただし書の規定に基づく特別の事情がある場合の利用料を示す。	学術研究機関	中小企業	
技術相談		無料	1件あたり最初の2時間まで10,000円。相談時間を延長する場合は、延長2時間につき15,000円（技術相談は、原則として1日につき1回2時間までとする。）。 なお、上記以外に作業費が発生する場合は、実費を別途請求する。		
技術代行	原子分解能多機能透過電子顕微鏡 [NEOARM] (JEM-ARM200F)	38,900 (72,240)	77,800 (144,480)	116,700 (216,720)	1検体 (4時間以内)
	200kV透過電子顕微鏡 [200kV-TEM] (※1) (JEM-2200FS)	11,090 (20,590)	22,180 (41,180)	33,260 (61,780)	1検体 (4時間以内)
	走査透過電子顕微鏡 [STEM] (HD-2700)	36,040 (66,920)	72,070 (133,850)	108,110 (200,770)	1検体 (4時間以内)
	超高分解能電界放出型電子顕微鏡 [FE-SEM] (SU9000)	10,550 (19,590)	21,100 (39,180)	31,650 (58,770)	1検体 (4時間以内)
	低真空分析走査電子顕微鏡 [SEM] (SU6600)	7,470 (13,870)	14,940 (27,740)	22,410 (41,610)	1検体 (4時間以内)
	多機能分析走査電子顕微鏡 [SEM] (IT800 (SHL))	10,550 (19,590)	21,100 (39,180)	31,650 (58,770)	1検体 (4時間以内)
	微小デバイス特性評価装置 [nanoEBAC] (NE4000)	25,990 (48,270)	51,980 (96,540)	77,970 (144,810)	1検体 (4時間以内)
	表面ダイナミクス解析原子間力顕微鏡装置 [AFM] (NanoWizard ULTRA Speed2)	23,870 (44,330)	47,740 (88,660)	71,610 (132,990)	1検体 (4時間以内)
	二重収束型質量分析計 [Sector-MS] (※2、※3) (JMS-700 MStation)	2,310 (4,290)	4,620 (8,580)	6,390 (12,870)	1検体 (1時間以内)
	LC/TOFMS飛行時間型質量分析計 [ESI-TOFMS] (※4) (JMS-T100LC AccuTOF)	2,310 (4,290)	4,620 (8,580)	6,390 (12,870)	1検体 (1時間以内)
	LC/TOFMS高分解能飛行時間型質量分析計 (※4、※5) (AccuTOF LC-plus 4G, DART/ESI/CSI/APCI)	2,310 (4,290)	4,620 (8,580)	6,390 (12,870)	1検体 (1時間以内)
	マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計 [MALDI-TOFMS] (autoflex II)	2,310 (4,290)	4,620 (8,580)	6,390 (12,870)	1検体 (1時間以内)
	マトリックス支援レーザー脱離イオン化Spiral飛行時間型質量分析計 [MALDI-Spiral-TOFMS] (JMS-S3000)	2,310 (4,290)	4,620 (8,580)	6,390 (12,870)	1検体 (1時間以内)
	DART質量分析計 [DART-MS] (JMS-Q1000TD)	2,310 (4,290)	4,620 (8,580)	6,390 (12,870)	1検体 (1時間以内)
	X線構造解析装置 (※6) (SmartLab9kW/IP/HY/N)	3,850 (7,150)	7,700 (14,300)	11,550 (21,450)	1検体 (4時間以内)
	微小単結晶X線構造解析装置 (VariMax RAPID RA-Micro7)	21,020 (39,040)	42,040 (78,080)	63,060 (117,120)	1検体 (20時間以内)
	高性能単結晶X線自動解析装置 (XtaLAB Synergy-R/Cu)	25,200 (46,800)	50,400 (93,600)	75,600 (140,400)	1検体 (15時間以内)
	600MHz NMR (※7) (JNM-ECA600)	1,000 (1,860)	2,000 (3,720)	3,000 (5,580)	1検体 (0.5時間以内)
	500MHz NMR (※7、※8) (JNM-ECZ500R)	770 (1,430)	1,540 (2,860)	2,310 (4,290)	1検体 (0.5時間以内)
	400MHz 固体・溶液NMR (※7、※8、※9) (JNM-ECX400P)	770 (1,430)	1,540 (2,860)	2,310 (4,290)	1検体 (0.5時間以内)
電子スピン共鳴装置 [ESR] (JES-FA100N)	1,850 (3,430)	3,700 (6,860)	5,540 (10,300)	1検体 (4時間以内)	
多機能走査型X線光電子分光分析装置 [XPS]	7,390	14,780	22,180	1検体	

技術代行	(PHI 5000 VersaProbe II)	(13,730)	(27,460)	(41,180)	(8時間以内)
	顕微レーザーラマン分光光度計 (NRS-4100)	2,930 (5,430)	5,850 (10,870)	8,780 (16,300)	1検体 (4時間以内)
	円二色性分散計 [CD] (J-820)	2,620 (4,860)	5,240 (9,720)	7,850 (14,590)	1検体 (3時間以内)
	ダイナミック光散乱光度計 (DLS-6000)	4,850 (9,010)	9,700 (18,020)	14,550 (27,030)	1検体 (6時間以内)
	分光エリプソメーター (UVISEL ER AGMS-NSD)	4,310 (8,010)	8,620 (16,020)	12,940 (24,020)	1検体 (2時間以内)
	光ダイナミクス分光装置 (※10) (Mira 900) (KEC-160) (C10910-04)	10,630 (19,730)	21,250 (39,470)	31,880 (59,200)	1検体 (8時間以内)
	示差走査熱量計・示差熱重量同時測定装置 (DSC 7000X/STA 7200)	3,470 (6,440)	6,930 (12,870)	10,400 (19,310)	1検体 (4時間以内)
	大気中光電子分光装置 (AC-3)	1,000 (1,860)	2,000 (3,720)	3,000 (5,580)	1検体 (1時間以内)
	分光感度・内部量子効率測定装置 (CEP-2000RP)	2,160 (4,000)	4,310 (8,010)	6,470 (12,010)	1検体 (2時間以内)
微細形状測定装置 (ET200)	770 (1,430)	1,540 (2,860)	2,310 (4,290)	1検体 (1時間以内)	
技術補助	技術補助講習 (※11)	10,000	10,000	10,000	1講習 (4時間以内)
	一般技術補助	10,000	10,000	10,000	1時間
機器利用 (※11)	200kV透過電子顕微鏡 [200kV-TEM] (※1) (JEM-2200FS)	2,800 (5,200)	5,600 (10,400)	8,400 (15,600)	1時間
	超高分解能電界放出型電子顕微鏡 [FE-SEM] (SU9000)	2,700 (5,010)	5,390 (10,010)	8,090 (15,020)	1時間
	低真空分析走査電子顕微鏡 [SEM] (SU6600)	2,540 (4,720)	5,080 (9,440)	7,620 (14,160)	1時間
	多機能分析走査電子顕微鏡 [SEM] (IT800 (SHL))	2,770 (5,150)	5,540 (10,300)	8,320 (15,440)	1時間
	微小デバイス特性評価装置 [nanoEBAC] (※12) (NE4000)	8,670 (16,090)	17,340 (32,180)	26,010 (48,270)	1時間
	表面ダイナミクス解析原子間力顕微鏡装置 [AFM] (NanoWizard ULTRA Speed2)	4,620 (8,580)	9,240 (17,160)	13,860 (25,740)	1時間
	マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計 [MALDI-TOFMS] (※13) (autoflex II)	1,850 (3,440)	3,700 (6,880)	5,550 (10,320)	1時間
	DART質量分析計 [DART-MS] (JMS-Q1000TD)	1,850 (3,440)	3,700 (6,880)	5,550 (10,320)	1時間
	500MHz NMR (※7、※8) (JNM-ECZ500R)	1,540 (2,860)	3,080 (5,720)	4,620 (8,580)	1時間
	400MHz 固体・溶液NMR (※7、※8、※9) (JNM-ECX400P)	1,540 (2,860)	3,080 (5,720)	4,620 (8,580)	1時間
	多機能走査型X線光電子分光分析装置 [XPS] (PHI 5000 VersaProbe II)	850 (1,570)	1,690 (3,150)	2,540 (4,720)	1時間
	顕微レーザーラマン分光光度計 (NRS-4100)	1,000 (1,860)	2,000 (3,720)	3,000 (5,580)	1時間
	円二色性分散計 [CD] (J-820)	920 (1,720)	1,850 (3,430)	2,770 (5,150)	1時間
	ダイナミック光散乱光度計 (DLS-6000)	850 (1,570)	1,690 (3,150)	2,540 (4,720)	1時間
分光エリプソメーター (UVISEL ER AGMS-NSD)	1,460 (2,720)	2,930 (5,430)	4,390 (8,150)	1時間	

機器利用 (※11)	示差走査熱量計・示差熱重量同時測定装置 (DSC 7000X/STA 7200)	920 (1,720)	1,850 (3,430)	2,770 (5,150)	1時間
	大気中光電子分光装置 (AC-3)	1,000 (1,860)	2,000 (3,720)	3,000 (5,580)	1時間
	分光感度・内部量子効率測定装置 (CEP-2000RP)	690 (1,290)	1,390 (2,570)	2,080 (3,860)	1時間
	微細形状測定装置 (ET200)	770 (1,430)	1,540 (2,860)	2,310 (4,290)	1時間
共同研究		無料	(※14)		1件

- ・利用時間に装置の立ち上げ・立ち下げに係る時間を含む。また、利用時間は原則として平日の9時から17時までの間とする。
- ・技術代行において1検体当たりの標準測定時間を超過する場合又は特別な観察若しくは分析に必要な処理を要する場合は、規定の利用料に加え、別途実費相当額を利用料として徴収することがある。

(※1) EELS、電子回折法及びクライオ電子顕微鏡法による測定はできない。

(※2) 1検体では、ポジティブモード又はネガティブモードのどちらか1モードでの測定となる。両モードの測定を希望する場合は、2検体となる。

(※3) GC利用の場合は、再現性確認のために2回にわたって測定を行うことから、1検体当たり2倍の利用料を徴収する。これに加え、装置の起動及び条件調整に係る料金として1測定当たり別途3検体分の利用料を徴収する。

(※4) 本学のカラムを利用する場合は、1検体当たり別途1,000円（消費税及び地方消費税を除く。）の利用料を徴収するとともに、測定に時間を要するため1検体当たり3倍の利用料を徴収する。また、本学で移動相を用意する場合は、1検体当たり別途500円（消費税及び地方消費税を除く。）の利用料を徴収する。これに加え、装置の起動及び条件調整に係る料金として、LC条件提示が有る場合は1測定当たり別途4検体分、LC条件提示が無い場合は1測定当たり別途8検体分の利用料を徴収する。

(※5) CSI測定の場合は、装置の起動に係る料金として1測定当たり別途1検体分の利用料を徴収する。

(※6) 1測定当たりの測定時間は最大4時間（装置の立ち上げに係る時間としての1時間を含む。）とし、これを超える場合は、以降3時間ごとに1検体分の利用料を徴収する。また、オプションユニットを利用して測定した場合は、その測定の種類に応じ、条件調整に係る料金として、1測定当たり別途次の利用料を徴収する。

- ①CuK α 1単色化用Ge(220)2結晶法の場合：1,000円（消費税及び地方消費税を除く。）
- ②環境雰囲気ユニットを用いた測定の場合：1,000円（消費税及び地方消費税を除く。）
- ③逆格子マップ測定の場合：10,000円（消費税及び地方消費税を除く。）
- ④インプレーン測定の場合：5,000円（消費税及び地方消費税を除く。）
- ⑤2DXRD測定の場合：5,000円（消費税及び地方消費税を除く。）
- ⑥昇温測定の場合：10,000円（消費税及び地方消費税を除く。）

(※7) 溶液試料測定に用いる重水素化溶媒は、利用者が用意する。

(※8) 1測定当たりの測定時間は、最大3時間とする。

(※9) 液体サンプルについては技術代行又は機器利用、固体サンプルについては技術代行のみ可能とする。

(※10) 利用機器の使用数にかかわらず、1検体当たりの利用料とする。

(※11) 利用者が機器利用をする場合は、あらかじめ機器操作に関する講習として技術補助講習を受講することを基本とする。なお、技術補助講習時に利用者の試料を用いて講習を行い、その講習時に得られたデータを利用する場合は、技術代行に係る料金として別途1検体分の利用料を徴収する。

(※12) 本学のプローブを利用する場合は、1プローブ当たり別途20,000円（消費税及び地方消費税を除く。）の利用料を徴収する。

(※13) 機器利用において、プレートについては利用者が持込み、サンプル等のプリパレーションについては利用者が用意した後に利用することを基本とする。なお、本学のプレートを利用し、サンプル等のプリパレーションを本学で用意する場合は、1測定当たり別途5,000円（消費税及び地方消費税を除く。）の利用料を徴収する。

(※14) 利用料は、第21条の規定に基づいてセンター長が別に定める取扱いに従って徴収する。

第10条第2項の規定に基づく各支援業務及び共用設備等における利用料金一覧

業務			分類	共用設備等 (通称、型番等)	利用料 (円) (消費税及び地方消費税を除く。)	試験単位等 (標準測定時間)
技術相談					無料	
技術代行	技術補助	機器利用				
○			顕微鏡装置	原子分解能多機能透過電子顕微鏡 [NEOARM] (JEM-ARM200F)	800	60分間
○	○	○		200kV透過電子顕微鏡[200kV-TEM] (JEM-2200FS)	400	60分間
○				走査透過電子顕微鏡[STEM] (HD-2700)	740	60分間
	○	○		超高分解能電界放出型電子顕微鏡[FE-SEM] (SU9000)	150	30分間
	○	○		低真空分析走査電子顕微鏡[SEM] (SU6600)	105	30分間
	○	○		多機能分析走査電子顕微鏡[SEM] (IT800 (SHL))	150	30分間
○	○	○		微小デバイス特性評価装置[nanoEBAC] (NE4000)	680	1回
○	○	○		表面ダイナミクス解析原子間力顕微鏡装置[AFM] (NanoWizard ULTRA Speed2)	150	30分間
○	○	○		質量分析計	二重収束型質量分析計[Sector-MS] (JMS-700 MStation)	120
○	○	○	LC/TOFMS飛行時間型質量分析計[ESI-TOFMS] (JMS-T100LC AccuTOF)		120	10分間
○			LC-TOFMS高分解能飛行時間型質量分析計 (AccuTOF LC-plus 4G, DART/ESI/CSI/APCI)		120	10分間
○	○	○	マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計[MALDI-TOFMS] (autoflex II)		120	10分間
○	○	○	マトリックス支援レーザー脱離イオン化Spiral飛行時間型質量分析計[MALDI-Spiral-TOFMS] (JMS-S3000)		120	10分間
○	○	○	DART質量分析計[DART-MS] (JMS-Q1000TD)		120	10分間
○	○	○	X線解析装置		X線構造解析装置 (SmartLab9kW/IP/HY/N)	75
○	○	○		微小単結晶X線構造解析装置 (VariMax RAPID RA-Micro7)	75	30分間
○	○	○		高性能単結晶X線自動解析装置 (XtaLAB Synergy-R/Cu)	100	30分間
○	○	○	核磁気共鳴装置 及び 電子スピン共鳴装置	600MHzNMR (JNM-ECA600)	15	10分間
○	○	○		500MHzNMR (JNM-ECZ500R)	15	10分間
○	○	○		400MHz固体・溶液NMR (※1) (JNM-ECX400P)	15	10分間
○	○	○		電子スピン共鳴装置[ESR] (JES-FA100N)	60	30分間
○	○	○	表面分析装置	多機能走査型X線光電子分光分析装置[XPS] (PHI 5000 VersaProbe II)	105	30分間
○	○	○	光学測定装置	顕微レーザーラマン分光光度計 (NRS-4100)	30	30分間
○	○	○		円二色性分散計[CD] (J-820)	80	60分間
○	○	○		ダイナミック光散乱光度計 (DLS-6000)	30	30分間
○	○	○		分光エリプソメーター (UVISEL ER AGMS-NSD)	70	30分間
○	○	○		光ダイナミクス分光装置 (Mira 900) (KEC-160) (C10910-04)	110	30分間
○	○	○	物性測定装置	示差走査熱量計・示差熱重量同時測定装置 (DSC 7000X/STA 7200)	60	60分間
○	○	○		大気中光電子分光装置 (AC-3)	180	30分間
	○	○		分光感度・内部量子効率測定装置 (CEP-2000RP)	45	30分間
	○	○	クリーンルーム	微細形状測定装置 (ET200)	10	10分間

・この表は、第10条第2項の規定に基づき、センター長が委員会の承認を経て一部を免除した利用料であり、利用者のうち本学の研究者等がその適用を受けるものとする。

(※1) 液体サンプルについては技術代行又は機器利用を、固体サンプルについては技術代行のみを可能とする。